



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种能精确测量超薄工件厚度方法及仪器

文献类型: 专利

作者 蔡桂喜, 韩晓华, 刘畅, 徐华, 董瑞琪 and 贾中青

发表日期 2009-12-30

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 一种能精确测量超薄工件厚度方法,采用信号处理的方法来提取表征工件厚度的超声波信息,既适合于测量超薄大曲率工件厚度也适合于测量普通工件厚度的超声测厚技术,它的核心是对接收到的回波信号进行快速傅里叶变换从而获得测量结果;一种能精确测量超薄工件厚度方法的仪器,由探头和主机两部分组成,主机部分包括DSP控制模块、超声波发射电路、超声波信号接收电路,信号放大电路、闸门电路、通讯接口、液晶显示器和键盘。本发明的优点:既适合于测量超薄大曲率工件厚度也适合于测量普通工件厚度,可实时采集超声回波信号,实时的进行快速傅里叶变换,实时计...

公开日期 2009-12-30

语种 中文

专利申请号 CN101614533

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/67347]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 蔡桂喜, 韩晓华, 刘畅, 徐华, 董瑞琪 and 贾中青. 一种能精确测量超薄工件厚度方法及仪器. 2009-12-30. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
259	0	0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

